

Загрузка оборудования МРЦКП «Современные физико-химические методы формирования и исследования материалов для нужд промышленности, науки и образования» в 2020 году

Наименование оборудования	Фактическое время работы оборудования, час
Спектрофлуориметр RF-6000	1749
Анализатор CHNS-O в органических материалах EuroEA 3028 (EuroVector)	1749
ИК-Фурье спектрометр «Инфралюм ФТ-02» (Люмэкс)	1749
Установка электронно-лучевого напыления STE EB 48 (SemiTEq)	1749
Дифференциальный сканирующий калориметр DSC131 (Setaram)	1749
Система плазменной очистки 25 Zephyr (Oxford Instruments) для камеры электронного микроскопа EVO	1749
Генератор частот FSY ND-D 500/500 (SCHOMANDL)	1749
Прибор синхронного термического анализа ТГ-ДТА/ДСК STA 449 F3 Jupiter (Netzsch)	1749
Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный портативный СПЕКТРОСКАН GEO D (Спектрон)	1749
Метеокомплекс на базе компактной метеостанции WS500-UMB (Lufft)	1749
Станция контроля качества атмосферы DustTrak 8533 (ОПТЭК)	1749
Датчик повышенной чувствительности NM 03810R05 Royalprobe для ЯМР-спектрометра ECX-400A (Jeol)	1749
Дифрактометрический модуль для растрового электронного микроскопа EVO 40 EBSD-120404-SPB-1 (Carl Zeiss)	1749
Измерительный модуль на базе анализатора импеданса HP 4291B (Novocontrol Technologies)	1749
Диэлектрический спектрометр “Novocontrol Concept 41”	1749
Рентгеновский дифрактометр «ДРОН-7»	1749
Рентгеноэлектронный спектрометр SM 4201TERLAB	1749
Рентгенофлуоресцентный спектрометр X-Арт М (Комита)	1749
ИК-Фурье-спектрометр ФСМ 1211 (Инфраспек)	1749
ИК-Фурье-спектрометр ФСМ 1202 (Инфраспек)	1749
Анализатор термостимулированных токов TSC-II (Setaram)	1749
Микроволновой реактор Milestone MicroSYNTH	1749
Элементный анализатор EA3028 (Eurovector)	1749
УФ-спектрофотометр UV2401 PC (Shimadzu)	1749
ИК-спектрометр с Фурье-преобразованием IRPrestige-21 (Shimadzu)	1749
ЯМР-спектрометр Jeol ECX 400A (400 МГц)	1749
Напылитель для электронного микроскопа	1749

Универсальный сверхвысоковакуумный электронный спектрометр УСУ-4	1749
Установка ионно-плазменного напыления (нанесения упрочненного покрытия) УВМИПА-1-001	1749
Растровый электронный микроскоп EVO-40 (Carl Zeiss)	1749
Сканирующий зондовый микроскоп Solver P-47 Pro (NT-MDT)	1749
Атомно-силовой сканирующий микроскоп Smena (NT-MDT)	1749
Измерительный комплекс СКАТ (ОПТЭК)	1749
Масс-спектрометр Nu HORIZON IRMS (Nu-Instruments Ltd.)	1749
Лабораторная установка на базе масс-спектрометра Hiden HAL/3F PIC 200	1749
Система автоматической пробоподготовки образцов, содержащих С-14 и Н-3 для анализа на жидкосцинтилляционных счетчиках на базе А307 Sample Oxidiser (PerkinElmer)	1749
Анализатор серы и углерода SC-144DR (LECO)	1749
Ультра низкофоновый жидкосцинтилляционный спектрометр-радиометр Quantulus 1220 (Wallac)	1749

Директор МРЦКП



Грабов В. М.